# 请扫码登记



无线网名称: BUAA\_SME3, 无线网密码: sme41sme



扫码登记



课程微信群



# 微电子器件实验

彭守仲

北京航空航天大学 微电子学院

第一馆203办公室 shouzhong.peng@buaa.edu.cn

2020年11月2日

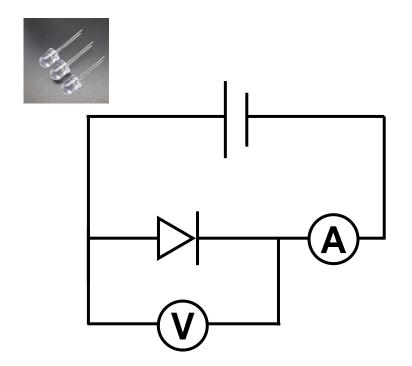


- 直流特性实验内容
  - 1、二极管的直流特性测量与分析
  - 2、双极型晶体管的直流特性测量与分析
  - 3、场效应晶体管的直流特性测量与分析

- 频率特性实验内容
  - 1、双极型晶体管的频率特性测量与分析
  - 2、场效应晶体管的频率特性测量与分析



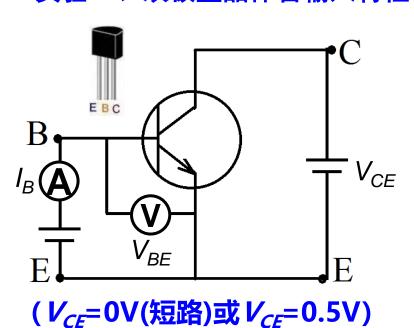
#### 实验一、二极管直流特性



#### ■ 注意事项

- 1. 请测量发光二极管(小心烫手)
- 2. 反向击穿电压大于30V

#### 实验二、双极型晶体管输入特性



#### 注意事项:

- V<sub>CE</sub>=0V时CE端不需要连接电压源, 只需用导线连接
- 2. V<sub>CE</sub>太大会烧毁器件(小心烫手), 建议*V<sub>CE</sub>*=0.5V
- 3. 反向击穿电压约为-12.5V



#### ■ 输出特性曲线

1.调节*E<sub>B</sub>*使

 $I_B = 20/40/60/80/100 \mu A$ 

2.调节*E*c使

E<sub>C</sub>=0.1-1V以及1-10V

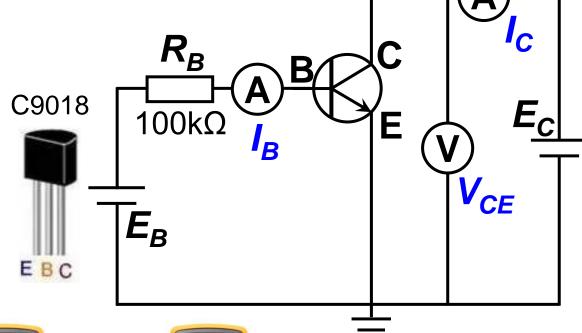
 $3.测量 V_{CE} 和 I_C 并画图$ 



电压源 产生电压*E<sub>B</sub>和E<sub>C</sub>* 



手持式万用表1测量电压 $V_{CE}$ 





手持式万用表2 测量电流 $I_c$ 



台式万用表测量电流/<sub>8</sub>



#### ■ 放大特性测量

- 1.使 $I_B$ =60 $\mu$ A,  $E_C$ =15V
- 2.任意波形发生器输出

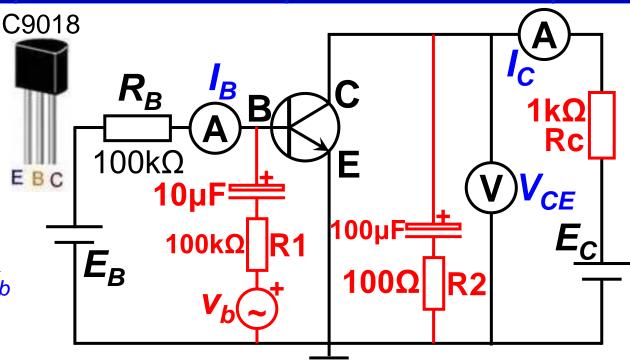
1KHz、1V(2.5V,5V,

7.5V,10V,15V)信号V<sub>b</sub>

3.用示波器分别测量

R1和R2的电压波形

4.计算电流放大系数i\_/i<sub>b</sub>





任意波形发生器 产生交流信号 v<sub>n</sub>



数字示波器 测量R1和R2电压波形

C9018



1kΩ

#### ■ 频率特性测量

- 1.使 $I_B$ =60 $\mu$ A,  $E_C$ =15V,  $V_b$ 峰峰值10V
- 2.改变v<sub>b</sub>的频率(1KHz,

10KHz,100KHz,250KHz,

1MHz,2MHz,3MHz等)

测量R2的电压波形和RMS

- 3.计算电流放大系数 $h_{fe}=i_c/i_b$
- 4. h<sub>fe</sub>下降为0.7为截止频率f<sub>β</sub>
- 5.特征频率 $f_T = h_{fe} \times f_{\beta}$



任意波形发生器 产生交流信号 v<sub>n</sub>



数字示波器 测量R1和R2电压波形

#### 直流和频率特性测量与分析



- 直流特性实验内容
  - 1、二极管的直流特性测量与分析
  - 2、双极型晶体管的直流特性测量与分析
  - 3、场效应晶体管的直流特性测量与分析

#### ■ 频率特性实验内容

- 1、双极型晶体管的频率特性测量与分析
- 2、场效应晶体管的频率特性测量与分析

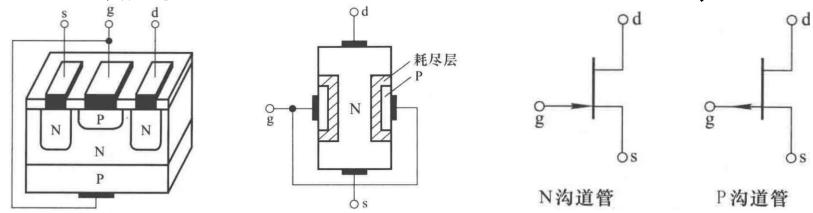


- 场效应管(Field Effect Transistor, FET)
  - 利用输入回路的电场效应来控制输出回路的电流的半导体器件
  - 仅靠半导体中的多数载流子导电,又称**单极型晶体管**
  - 体积小、重量轻、寿命长、噪音低、热稳定性好、耗电低…
  - 场效应管是现代超大规模数字集成电路的基础器件

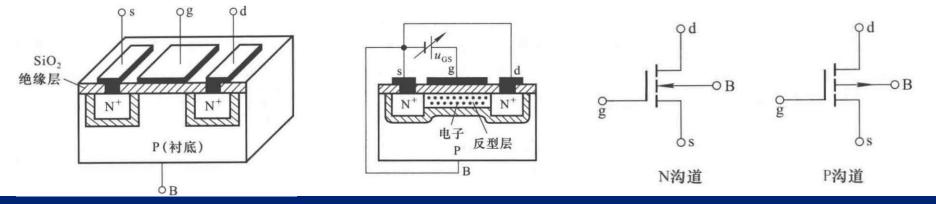




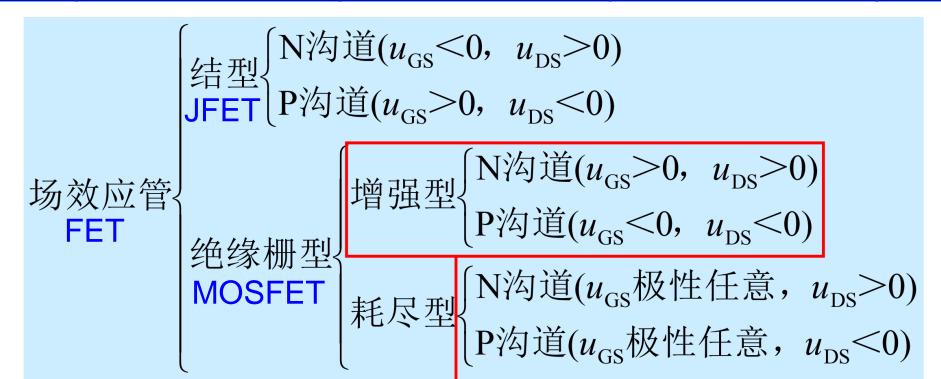
■ 结型场效应管(Junction Field Effect Transistor, JFET)



- 绝缘栅型场效应管(Insulated Gate Effect Transistor, IGFET)
  - MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor, MOS)
  - 栅-源间电阻更大(10<sup>10</sup>Ω)、温度稳定性好、集成工艺简单





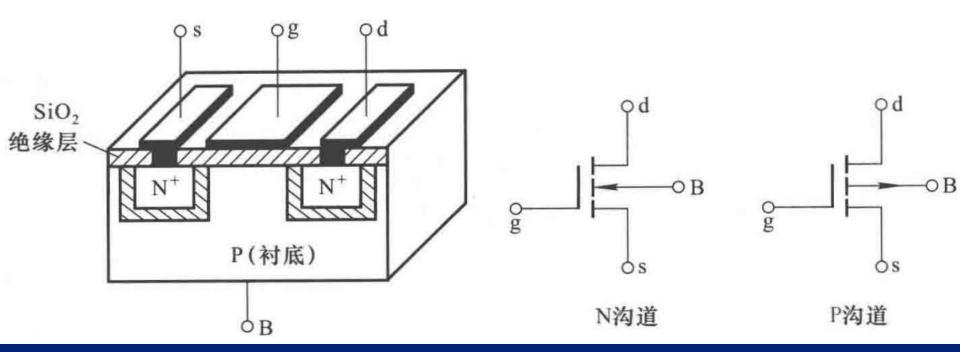




N沟道MOS管: IRF3205

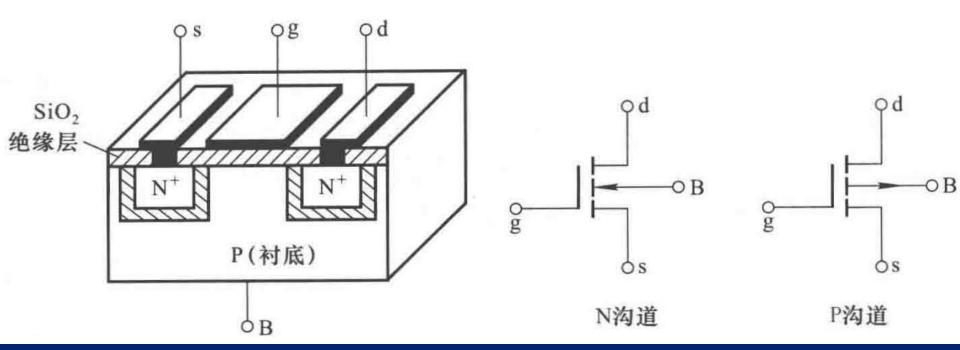


- N沟道增强型MOS管
  - 一个低掺杂的P型硅片为衬底
  - 两个高掺杂的N+区引出电极作为源极Source和漏极Drain
  - 覆盖一层SiO₂绝缘层
  - 覆盖一层金属铝引出电极作为栅极Gate



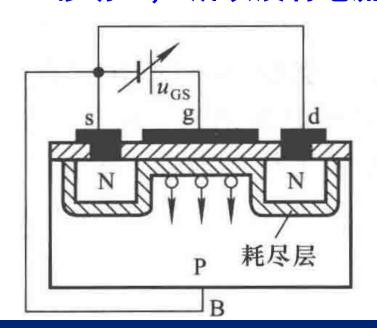


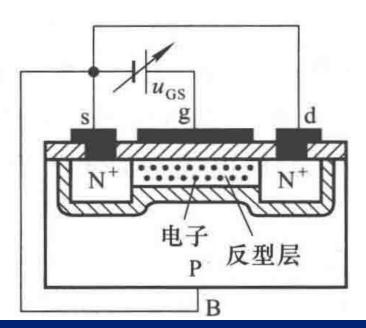
- N沟道增强型MOS管工作原理1(u<sub>GS</sub>=0)
  - 当栅-源之间不加电压(*u<sub>cs</sub>=0*)时,漏-源之间是两只背向的PN结,不存在导电沟道,因此即使漏-源之间加电压,也不会有漏极电流





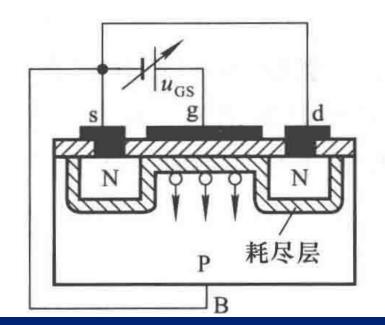
- N沟道增强型MOS管工作原理2(u<sub>GS</sub>>0)
  - 当栅-源之间施加电压( $u_{GS}>0$ )且 $u_{DS}=0$ 时,由于有SiO<sub>2</sub> 绝缘层存在,栅极电流仍然为零
  - 但是栅极金属层将排斥空穴,留下负离子,形成耗尽层
  - 漏极与源极之间没有载流子(空穴被排斥了,负离子不能 移动)。 所以没有电流

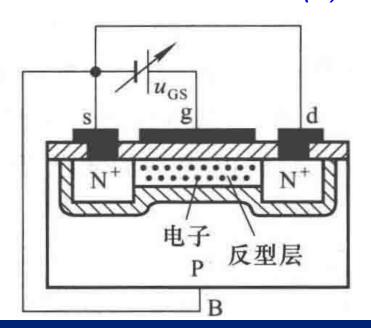






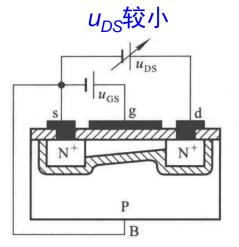
- N沟道增强型MOS管工作原理2(u<sub>GS</sub>>0)
  - 当*u<sub>cs</sub>*>0增大时,一方面耗尽层增宽;另一方面氧化物-硅界面处的电位增高,衬底的电子逐渐被吸引到栅极氧化物下方,形成一个N型薄层,称为反型层,从而构成漏-源之间的导电沟道。
  - 产生反型层所需的临界电压被称为开启电压 $U_{GS(th)}$

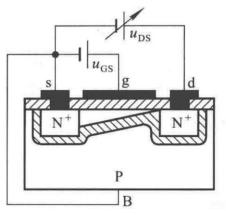


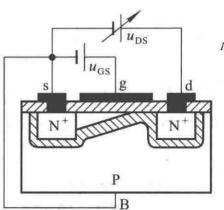


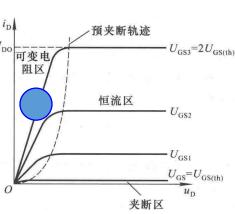


- N沟道增强型MOS管工作原理3(u<sub>GS</sub>> U<sub>GS(th)</sub>)
  - 当 $u_{GS}$ >  $U_{GS(th)}$ 时,漏-源之间电压 $u_{DS}$ 可以产生漏极电流 $i_D$
  - 当 $u_{DS}$ 较小时,沟道沿源-漏方向逐渐变窄但未出现夹断,此时  $i_D$ 随 $u_{DS}$ 线性增大(可变电阻区)
  - 此时的输出特性曲线近似为直线,直线斜率的倒数就是 d-s之间的等效电阻,并可以通过改变 $u_{GS}$ 的大小(压控) 改变d-s电阻



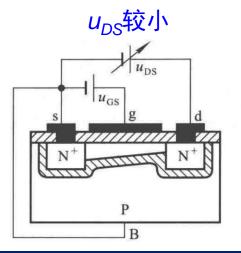


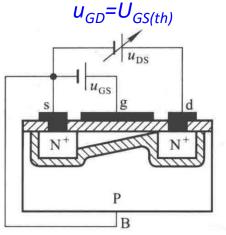


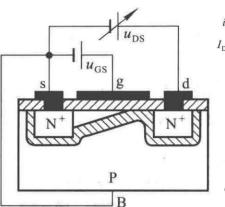


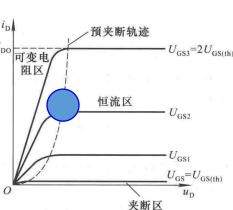


- N沟道增强型MOS管工作原理3(u<sub>GS</sub>> U<sub>GS(th)</sub>)
  - 当 $u_{GS}$ >  $U_{GS(th)}$ 时,漏-源之间电压 $u_{DS}$ 可以产生漏极电流 $i_D$
  - 当 $u_{DS}$ 增大到使 $u_{GD}$ = $U_{GS(th)}$ 时,沟道在漏极一侧出现夹断点,称为预夹断。
  - 把不同 $u_{GS}$ 下的预夹断点连起来就是预夹断轨迹



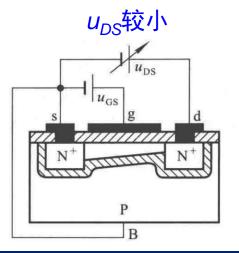


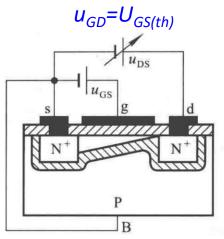


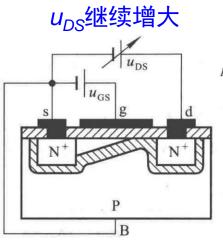


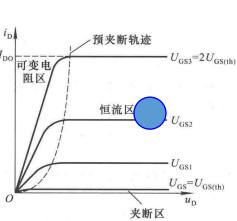


- N沟道增强型MOS管工作原理3(u<sub>GS</sub>> U<sub>GS(th)</sub>)
  - 当 $u_{GS}$ >  $U_{GS(th)}$ 时,漏-源之间电压 $u_{DS}$ 可以产生漏极电流 $i_D$
  - = 当 $u_{DS}$ 继续增大时,夹断区延长,此时 $u_{DS}$ 增大的部分几乎全部用来克服夹断区对漏极电流 $i_D$ 的阻力。
  - 因此,此时 $i_D$ 几乎不随 $u_{DS}$ 的增大而变化,即为恒流区
  - 恒流区的电流 $i_D$ 几乎仅取决于 $u_{GS}$ 的,此时可以把 $i_D$ 看作为电压 $u_{GS}$ 控制的电流源





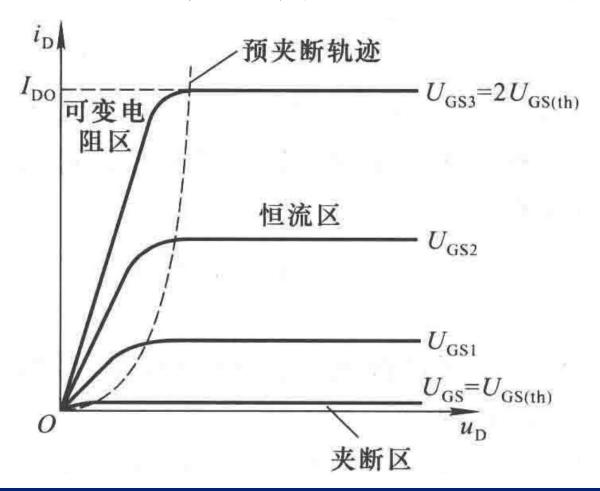






- N沟道增强型MOS管输出特性曲线
  - 可变电阻区、恒流区、夹断区

$$i_{\rm D} = I_{\rm DO} \left( \frac{u_{\rm GS}}{U_{\rm GS(th)}} - 1 \right)^2$$

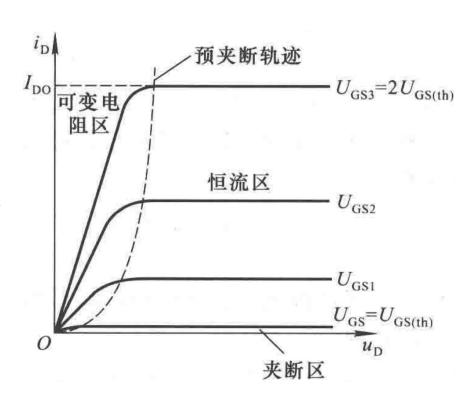




- N沟道增强型MOS管输出特性曲线
  - 低频跨导是漏-源电压一定时,栅极电压增量与由此产生的漏电流增量之比的倒数,即

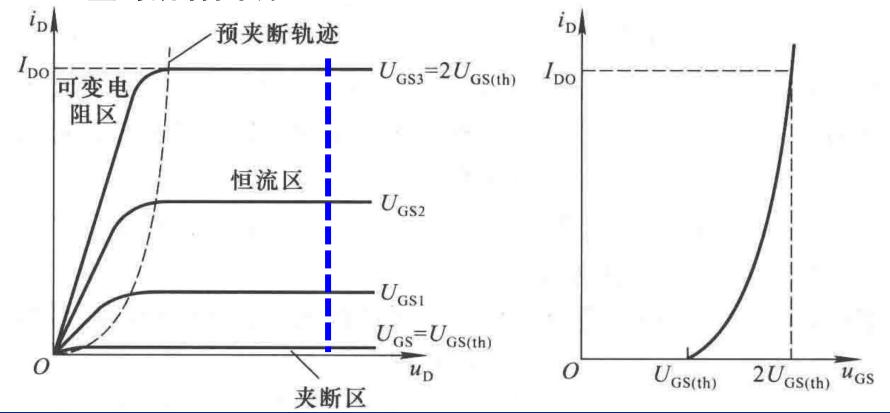
$$g_{\rm m} = \frac{\Delta i_{\rm D}}{\Delta u_{\rm GS}} \bigg|_{U_{\rm DS} = \mathring{\pi} \stackrel{\cong}{=} }$$

■ 跨导表征栅电压对漏电流的控制能力,是衡量场效应管放大作用的重要参数,类似于双极型晶体管的电流放大系数



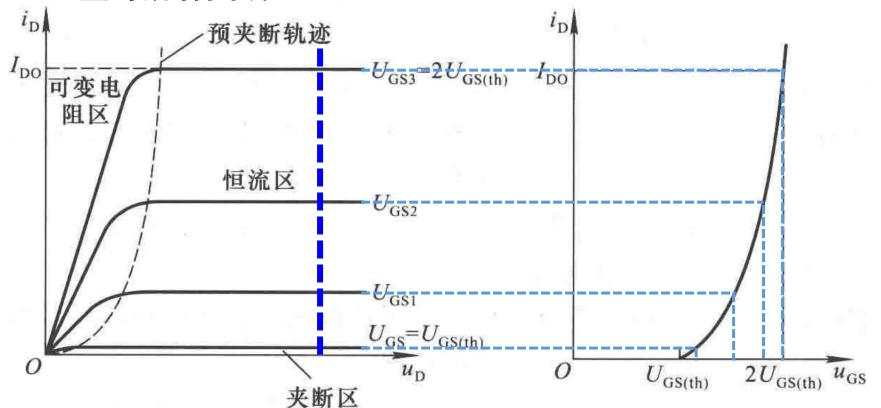


- N沟道增强型MOS管转移特性曲线
  - 当场效应管工作在恒流区时,由于输出特性曲线可近似看为一组平行线,所以可以用一条转移特性曲线来代替恒流区的所有曲线



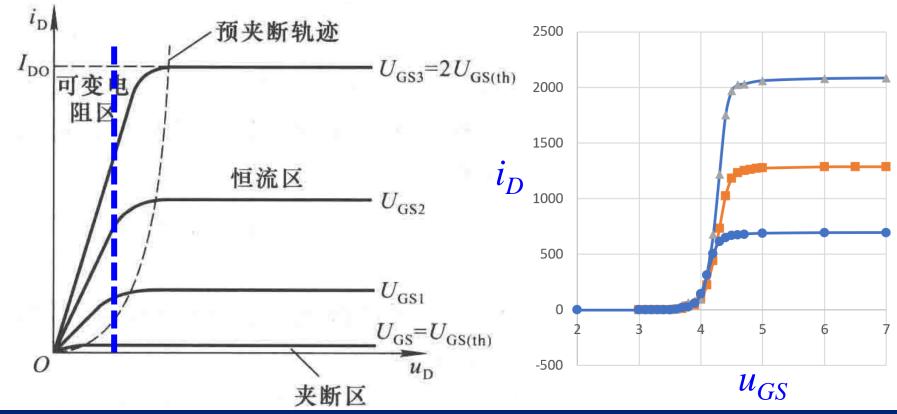


- N沟道增强型MOS管转移特性曲线
  - 当场效应管工作在恒流区时,由于输出特性曲线可近似看为一组平行线,所以可以用一条转移特性曲线来代替恒流区的所有曲线



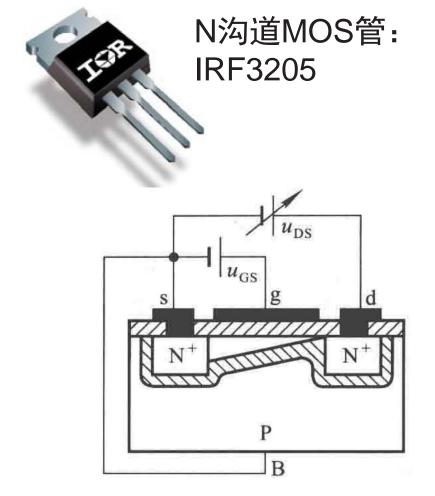


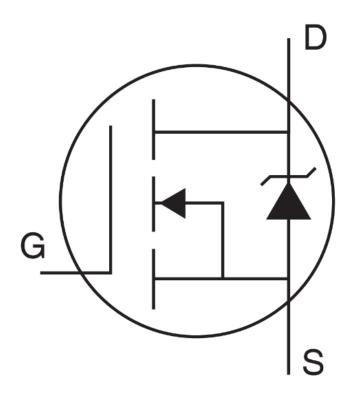
- N沟道增强型MOS管转移特性曲线
  - 当场效应管工作在恒流区时,由于输出特性曲线可近似看为一组平行线,所以可以用一条转移特性曲线来代替恒流区的所有曲线





■ N沟道增强型MOS管s-d二极管伏安特性曲线





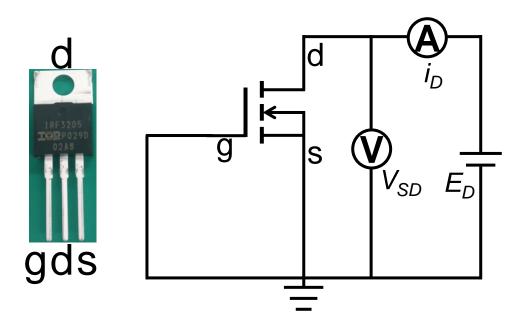
#### MOS管的s-d伏安特性曲线



- 实验一:s-d伏安特性曲线
- 1.调节 $E_D$ 使

 $E_D = 0-1.5 \text{V}$ 

2. 测量 $V_{SD}$ 和 $i_D$ 并画图





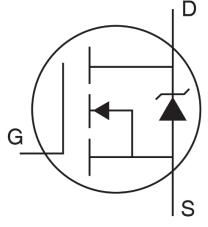
电压源 产生电压*E*。



手持式万用表2 测量电压V<sub>so</sub>



台式万用表 测量电流*i*。



#### MOS管的转移特性曲线



- 实验一:转移特性曲线
- 1.调节*E*应使

 $E_D = 0.5 \text{V}/1.0 \text{V}/1.5 \text{V}$ 

2.调节*E*。使

E<sub>G</sub>=0.1-7V(3-5V多取点)

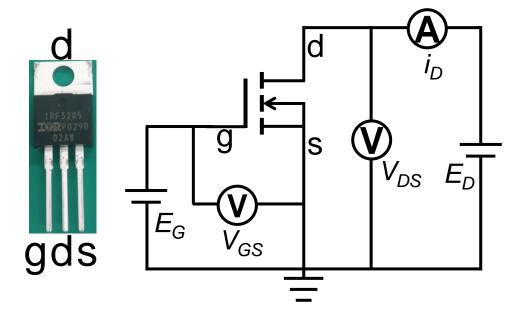
 $3.测量 V_{GS}和 i_D$ 并画图



电压源 产生电压*E<sub>G</sub>和E<sub>D</sub>* 



手持式万用表1 测量电压*V<sub>cs</sub>* 





手持式万用表2 测量电压V<sub>Ds</sub>



台式万用表 测量电流 i<sub>n</sub>

#### 思考题



#### ■思考题:

- 1. 请列举场效应管与双极型晶体管的几个不同点。
- 2. 请根据转移特性曲线图画出输出特性曲线中的恒流区曲线示意图。

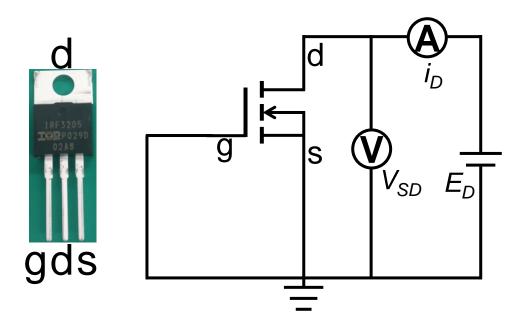
#### MOS管的s-d伏安特性曲线



- 实验一:s-d伏安特性曲线
- 1.调节 $E_D$ 使

 $E_D = 0-1.5 \text{V}$ 

2. 测量 $V_{SD}$ 和 $i_D$ 并画图





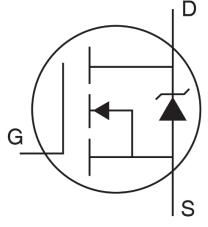
电压源 产生电压*E*。



手持式万用表2 测量电压V<sub>so</sub>



台式万用表 测量电流*i*。



#### MOS管的转移特性曲线



- 实验一:转移特性曲线
- 1.调节*E*应使

 $E_D = 0.5 \text{V}/1.0 \text{V}/1.5 \text{V}$ 

2.调节*E*。使

E<sub>G</sub>=0.1-7V(3-5V多取点)

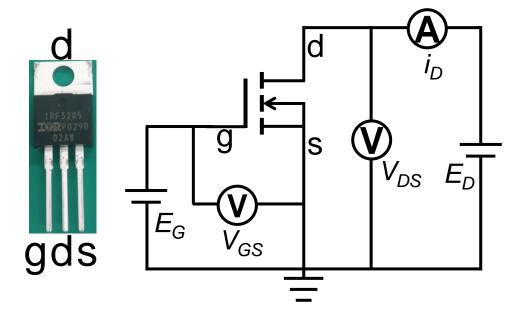
 $3.测量 V_{GS}和 i_D$ 并画图



电压源 产生电压*E<sub>G</sub>和E<sub>D</sub>* 



手持式万用表1 测量电压*V<sub>cs</sub>* 





手持式万用表2 测量电压V<sub>Ds</sub>



台式万用表 测量电流 i<sub>n</sub>

有某些就大大智 此有某些就大大智 上有某些就大大學



# 谢谢!